

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова» (КБГУ)

Институт информатики, электроники и робототехники

СОГЛАСОВАНО

**Кафедра электроники и цифровых информа-
ци-
он- УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель образовательной
программы

_____ Тешев Р.Ш.

Директора института

_____ Н.В. Черкесова

« _____ » _____ 2021г.

« _____ » _____ 2021г.

ных технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
**Б1.В.02.ДВ.02.02 «ДИАГНОСТИКА ПАРАМЕТРОВ НАНОМАТЕРИАЛОВ
И НАНОСТРУКТУР»**

Направление подготовки
11.03.04 –Электроника и наноэлектроника

Профиль: **Современные информационные технологии
в электронной технике**

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная

Нальчик 2021

Рабочая программа дисциплины: **Диагностика параметров наноматериалов и наноструктур** /сост. _Гаев Д.С. – Нальчик: КБГУ, 2021 - 26с.

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов очной формы обучения направления подготовки 11.03.04 – Электроника и микроэлектроника, 8 семестра, 4 курса.

Рабочая программа составлена в соответствии с учетом Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Электроника и нанотехнология», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» 09 2017 г. №927 и зарегистрированного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 10.10.2017 №48494.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля).....	4
4. Содержание и структура дисциплины.....	5
Содержание разделов дисциплины.....	5
4.2. Структура дисциплины.....	7
4.3. Лекционные занятия.....	7
4.4. Практические (Семинарские) занятия.....	7
4.5. Лабораторные работы.....	8
4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины.....	8
5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации.....	8
5.1. Коллоквиум.....	9
5.2. Тесты.....	11
5.3. Задания для лабораторных занятий.....	13
5.4. Промежуточная аттестация.....	15
5.4.1. Зачет.....	15
5.4.2. Экзамен.....	17
5.5. Контроль курсовых работ.....	18
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности.....	20
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.....	22
8. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий.....	23
9. Материально-техническое обеспечение работы.....	24
Лист изменений (дополнений) в рабочей программе дисциплины.....	26

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины дать представление об основных принципах современных физических методов, используемых для диагностики наноматериалов, и особенностях их применения для исследования различных типов наноструктур.

Задачи дисциплины:

- подготовка бакалавра к освоению физических и физико-химических основ методов и методик диагностики характеристических размеров, химического и фазового состава, структурных параметров и функциональных свойств (электрофизические, оптические, термогальваномагнитные, магнитные) наноматериалов и наноструктур;
- подготовка бакалавра к освоению физико-технологических процессов, лежащих в основе методов и методик диагностики характеристических размеров, химического и фазового состава, структурных параметров и функциональных свойств (электрофизические, оптические, термогальваномагнитные, магнитные) наноматериалов и наноструктур;
- подготовка бакалавра к освоению методами статистической обработки результатов и оценки погрешности измерений.

Цели и задачи дисциплины ориентированы на подготовку специалистов, способных решать проблемы, возникающие при производстве и эксплуатации изделий электроники и наноэлектроники с учетом области, типов и задач профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами:

- 40.058 «Инженер-технолог по производству изделий микроэлектроники», который утвержден приказом Минтруда России от 03.07.2019 №480н и зарегистрирован Минюстом России 29.07.2019 №55439;
- 40.104 «Специалист по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур», который утвержден приказом Минтруда России от 07.09.2015 №593н (В редакции, введенной в действие с 20.01.2019 г. приказом Минтруда России от 14.12.2018 №807н) и зарегистрирован Минюстом России 23.09.2015 г. №38983.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится вариативной части блока 1 дисциплин по выбору Б1.В.02.ДВ.02.02 учебного плана по направлению подготовки ВО 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, профиль: «Современные информационные технологии в электронной технике».

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Математика», «Физика», «Метрология, стандартизация и технические измерения», «Материалы электронной техники», «Компоненты электронной техники», «Основы технологии электронной компонентной базы», «Сканирующая зондовая микроскопия», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности».

Освоение учебной дисциплины диагностика параметров наноматериалов и наноструктур, необходимо для последующего изучения дисциплин: «Атомно-зондовая томография наноматериалов и наноструктур», «Корпускулярно зондовая нанотехнология», «Физика полупроводников и полупроводниковых наноструктур», выполнения выпускной квалификационной работы и приобретения знаний, умений и навыков частично продемонстрировать следующие обобщенные трудовые функции (ОТФ):

- Разработка единичных технологических процессов и рекомендаций по устранению и предупреждению браков в производстве изделий микроэлектроники (профессиональный стандарт 40.058 «Инженер-технолог по производству изделий микроэлектроники», код В, уровень квалификации 6).
- Разработка типовых технологических процессов и планировок рабочих мест и производственных участков на производстве изделий микроэлектроники (профессиональ-

ный стандарт 40.058 «Инженер-технолог по производству изделий микроэлектроники», код С, уровень квалификации 6).

● Совершенствование процессов измерений параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур (профессиональный стандарт 40.104 «Специалист по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур», код С, уровень квалификации 6).

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля)

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО направления подготовки ВО 11.03.04 Электроника и нанoeлектроника изучение дисциплины диагностика параметров наноматериалов и наноструктур направлено на частичное формирование элементов следующей компетенции:

Категория компетенции/ тип задач	Код и наименование компетенции	Индикаторы (показатели) достижения компетенций
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический	ПК-2 Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и нанoeлектроники различного функционального назначения	ПК-2.1. Способен применять основные экспериментальные методы в области электроники и нанoeлектроники ПК-2.2. Способен проводить исследования характеристик электронных приборов

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- физические и физико-химические основы базовых методов диагностики параметров наноматериалов и наноструктур;
- назначение, устройство и принцип действия используемого оборудования применяемого для диагностики параметров наноматериалов и наноструктур;
- методы оценки погрешностей измерений параметров наноматериалов и наноструктур;
- основные стандарты нормативные акты по планированию и организации работ по диагностике наноматериалов и наноструктур;
- метрологические аспекты подготовки производства изготовления изделий микроэлектроники.

Уметь:

- основными методиками диагностики параметров наноматериалов и наноструктур;
- методиками использования стандартных (эталонных, контрольных) образцов используемых в диагностике наноматериалов и наноструктур;

- статистическими методами обработки и представления результатов измерений параметров при диагностировании наноматериалов и наноструктур;
- методами оценки погрешностей измерений;

Владеть:

- подготовки наноматериалов и наноструктур к диагностированию их параметров;
- проведения диагностики характеристических параметров и свойств наноматериалов и наноструктур;
- статистической обработки результатов измерений параметров наноматериалов и наноструктур;
- проведения процесса модификации свойств наноматериалов и наноструктур.

4. Содержание и структура дисциплины

Содержание разделов дисциплины

В таблице 1 приводится описание содержания дисциплины, структурированное по разделам, с указанием по каждому разделу формы текущего контроля: защита лабораторной работы (ПЗ), коллоквиум (К), тестирование (Т).

Таблица 1. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Форма текущего контроля
1.	Метрологические аспекты диагностики параметров наноматериалов и наноструктур	Классификация и применение методов и средств диагностики для исследования, контроля и аттестации материалов. Программное обеспечение средств диагностики материалов и нанотехнологий. Классификация средств измерений. Погрешности измерений и характеристики средств измерений. Виды измерений. Методы измерений. Виды контроля. Методы статистической обработки результатов измерений и формы их представления. Государственная система аттестации и сертификации в России средств диагностики для исследования, контроля и аттестации материалов и нанотехнологий.	ПК-2	Т, К, ПЗ
2	Диагностические методы контроля характеристических размеров, морфологии поверхности, структуры и состава наноматериалов и наноструктур	Оптическая микроскопия. Сканирующая атомно-силовая и туннельная микроскопия. Сканирующая растровая и просвечивающая электронная микроскопия. Ионная микроскопия. Зондовые методы за пределами топографии. Подходы позволяющие получить дополнительную информацию о физических и химических свойствах материала на наноуровне. Рентгено-спектральный микроанализ. Рентгенодифракционные методы анализа наноматериалов. Методы определения удельной поверхности, пористости и размера частиц нанопорошков. Структурная нейтронография. Малоугловое и неупругое рассеяние нейтронов	ПК-2	Т,К, ПЗ

3	Диагностические методы контроля электрофизических параметров наноматериалов и наноструктур	Зондовые методы измерения удельного сопротивления: Однозондовый, двухзондовый, трехзондовый, четырехзондовый и пятизондовый методы измерения удельного сопротивления. Метод встречных зондов. измерения сопротивления. Контактные и бесконтактные методы измерения удельного сопротивления: Метод Ван-дер-Пау. Метод Ван-дер-Пау для измерения концентрации и подвижности. Требования к контактам, методы их изготовления, проверка омичности. Емкостной и индуктивный методы. СВЧ-методы. Методы определения параметров полупроводниковых материалов с использованием эффекта Холла в постоянных и переменных электрических и магнитных полях. Квантовый эффект Холла. Методы измерения параметров неравновесных носителей (подвижность, время жизни, диффузионная длина и т.д.: метод стационарной фотопроводимости, релаксации фотопроводимости.	ПК-2	Т,К, ПЗ
4	Методы диагностирования зонной структуры	Оптические методы измерения характеристик зонной структур: ширина запрещенной зоны, энергия активация примесей, энергия образования экситонов. Термостимулированные методы. Физические основы релаксационной спектроскопии глубоких уровней (РСГУ).. Основные виды РСГУ: емкостная и токовая РСГУ.	ПК-2	Т,К, ПЗ
5.	Диагностические методы контроля магнитных свойств наноматериалов и наноструктур	Введение в магнитный резонанс. Физические основы метода ЭПР. Применение ЭПР для исследования структуры и динамики наноразмерных систем.	ПК-2	Т,К,ПЗ

4.2. Структура дисциплины

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов)

Вид работы	Трудоёмкость, часы	
	8 семестр	Всего
Общая трудоемкость (в часах)	108	108
Контактная работа (в часах):	60	60
Лекции (Л)	40	40
Практические занятия (ПЗ)	20	20
Самостоятельная работа (в часах), в том числе контактная:	57	57
Самостоятельное изучение разделов	48	48
Самоподготовка:		
Курсовая работа (КР)	9	9

Подготовка и прохождение промежуточной аттестации		
Экзамен	27	27
Вид промежуточной аттестации	экзамен, к/р	

4.3. Лекционные занятия

Таблица 3. Перечень лекционных занятий

№ п/п	Тема	Код контролируемой компетенции (или ее части)
1	Метрологические аспекты диагностики параметров наноматериалов и наноструктур..	ПК-2
2	Диагностические методы контроля характеристических размеров, морфологии поверхности, структуры нано-материалов и наноструктур.	ПК-2
3	Диагностические методы контроля электрофизических параметров наноматериалов и наноструктур	ПК-2
4	Методы диагностирования зонной структуры	ПК-2
5	Диагностические методы контроля магнитных свойств наноматериалов и наноструктур	ПК-2

4.4. Практические (Семинарские) занятия

№ п/п	Наименование практических занятий	Код контролируемой компетенции (или ее части)
1	Определение холловской подвижности и концентрации основных носителей заряда в полупроводниках.	ПК-2
2	Определение диффузионной длины и времени жизни неравновесных носителей заряда в полупроводниках.	ПК-2
3	Определение ширины запрещённой зоны методом термостимулирования электропроводности.	ПК-2
4	Обработка и количественный анализ АСМ изображений.	ПК-2
5	Модификация поверхности кремния методом анодирования.	ПК-2
6	Определение удельной поверхности наноструктурированного кремния.	ПК-3

4.5. Лабораторные работы

Лабораторные занятия не предусмотрены программой

4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

Таблица 5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

№ п/п	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Код контролируемой компетенции (или ее части)
-------	--	---

1	Классификация нанообъектов, наноматериалов и наноструктур.	ПК-2
2	Сканирующая атомно-силовая и туннельная микроскопия	ПК-2
3	Метод Ван-дер-Пау. Метод Ван-дер-Пау для измерения концентрации и подвижности. Требования к контактам, методы их изготовления, проверка омичности. Емкостной и индуктивный методы. СВЧ-методы.	ПК-2
4	Методы определения параметров полупроводниковых материалов с использованием эффекта Холла в постоянных и переменных электрических и магнитных полях. Квантовый эффект Холла.	ПК-2
5	Термостимулированные методы. Физические основы релаксационной спектроскопии глубоких уровней (РСГУ).. Основные виды РСГУ: емкостная и токовая РСГУ.	ПК-2
6	Метод встречных зондов. измерения сопротивления.	ПК-2

5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Оценочные материалы для текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине определяются учебным планом образовательной программы и действующим положением о балльно-рейтинговой системе аттестации студентов обучающихся по программам высшего образования Кабардино-Балкарского университета (Приказ № 159/О от 31 августа 2017г.). При аттестации обучающихся оценивается качество работы на занятиях (умение вести дискуссию, способность чётко формулировать свои мысли), уровень подготовки к самостоятельной деятельности, качество выполнения заданий (курсовой работы, лабораторных работ и др.). Текущий и рубежный контроль успеваемости студентов по дисциплине проводится по трем контрольным точкам. В конце 1/3 семестра 1-я контрольная точка, вторая контрольная точка - конец 2/3 семестра, а третья контрольная точка последние две недели семестра.

Распределение баллов в рамках балльно-рейтинговой системы аттестации студентов приведена ниже:

Таблица 6. Распределение баллов текущего, рубежного контроля и экзамена

№		Общая сумма	1-я точка	2-я точка	3 точка
1.	Текущий контроль				
	посещение занятий	10 баллов	3 балла	3 балла	4 балла
	выполнение и защита лабораторных работ	21 балл	7 баллов	7 баллов	7 баллов
2.	Рубежный контроль				
	тестирование	15 баллов	5 баллов	5 баллов	5 баллов
	коллоквиум	24 балла	8 баллов	8 баллов	8 баллов
Итого		70 баллов	23 балла	23 балла	24 балла
3.	Экзамен	30 баллов	min – 15, max – 30 баллов		

5.1. Коллоквиум

В семестре проводятся 3 коллоквиума, каждый из которых оценивается в пределах от 0 до 8 баллов. Таким образом, максимальное количество баллов, которые может получить студент при условии успешной сдачи трех коллоквиумов равно 24.

На коллоквиумах контролируется формирование элементов профессиональных компетенций ПК-3. Ниже приведен примерный перечень вопросов и заданий, выносимых на коллоквиумы:

1-коллоквиум(Раздел 1,2):

1. Особенности измерения физических величин в наномасштабах
2. Метрологические аспекты наноиндустрии.
3. Основные стандарты нормативные акты по планированию и организации работ по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур.
4. Методы статистической обработки результатов измерений и формы их представления.
5. Оптическая микроскопия: виды микроскопии, особенности применения в исследованиях наноматериалов и наноструктур.
6. Сканирующая атомно-силовая: основы метода, аппаратная реализация, режимы сканирования, объекты и параметры измерения.
7. Сканирующая туннельная микроскопия: основы метода, аппаратная реализация, режимы сканирования, объекты исследования, параметры измерения и разрешение.
8. Сканирующая электронно- растровая микроскопия: основы метода, аппаратная реализация, режимы сканирования, объекты исследования, параметры измерения и разрешение.
9. Просвечивающая электронная микроскопия: основы метода, аппаратная реализация, режимы сканирования, объекты исследования, параметры измерения и разрешение.
10. Рентгенодифракционные методы анализа наноматериалов: общая характеристика методов, особенности исследования наноматериалов и наноструктур.

2-коллоквиум(Раздел 3):

- 1.Классификации, характеристика и возможности зондовых методов измерения удельного сопротивления наноматериалов и наноструктур.
- 2.Какие требования предъявляются к геометрической форме образца в методе четырех зондов?
- 3.Четырехзондовый метод измерения величины удельного сопротивления полупроводниковых материалов и структур. Преимущества, недостатки и возможности метода.
4. Выведите выражение для оценки удельного сопротивления, для случая, когда зонды 2 и 5 являются токовыми, а 1 и 4 потенциальными.
6. Почему включение зондов 1 и 4, в качестве токовых, предпочтительней в методе четырех зондов? Ответ обосновать.
7. Какими причинами обусловлены ограничения на величину тока в методе четырех зондов?
8. Какими причинами обусловлены ограничения на толщину пленок при измерении их удельного сопротивления методом четырех зондов?
9. Теория метода и вывод основной расчетной формулы для объемных (полубесконечных) образцов.
10. Особенность реализации четырехзондовой методики для определения величины удельного сопротивления эпитаксиальных слоев и многослойных структур.
- 11.Понятие величины поверхностного сопротивления и поверхностной проводимости.
12. Основные типы и источники погрешностей двухзондового метода определения величины удельного сопротивления материалов.
- 13.Общие и специфические источники погрешностей метода (в сравнении с четырехзондовым методом).

3-коллоквиум(Раздел 5,6):

1. Возможности вольт-фарадного метода в исследовании электрофизических параметров структур с пониженной размерностью (МДП-структуры).
2. Определение спектральных зависимостей поверхностных параметров методом двухтемпературной проводимости.
3. Определение типа проводимости и уровня легирования поверхностных слоев вольтфарадным методом
4. Поверхностные электронные состояния и их классификация
5. Теория приповерхностной области пространственного заряда полупроводника
6. Оптические методы измерения характеристик зонной структур: ширина запрещенной зоны, энергия активации примесей, энергия образования экситонов.
7. Термостимулированные методы.
8. Физические основы релаксационной спектроскопии глубоких уровней (РСГУ).
9. Основные виды РСГУ: емкостная и токовая РСГУ.
10. Физические основы метода ЭПР.
11. Магнито-силовая микроскопия.

Методические рекомендации

При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты лекций и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника. При подготовке к коллоквиуму также рекомендуется посещение консультаций для своевременного снятия возникших вопросов в процессе подготовки. Коллоквиум проводится в виде устного опроса и собеседования со студентом.

Критерии оценивания

Степень подготовленности студента на коллоквиуме оценивается по следующим критериям: - *ясность, четкость и доказательность изложения ответов на вопросы*; - *владение специальными терминами*; *системность знаний по теме коллоквиума*. Ниже приведена шкала оценивания:

Таблица 7. Критерии оценивания студента на коллоквиуме

Оценка			
2 балла «Неудовлетворительно»	4 балла «Удовлетворительно»	6 баллов «Хорошо»	8 баллов «Отлично»
Студент не знает значительной части вопросов, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы	Студент поверхностно знает вопросы коллоквиума, допускает неточности в ответе на вопрос	Студент хорошо знает материал, грамотно и по существу излагает его, допуская некоторые неточности в ответе на вопрос	Студент в полном объеме знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

5.2. Тесты

Тестирование по изучаемым разделам проводится 3 раза в семестр. На тестах контролируется формирование элементов профессиональных компетенций ПК-3. Ниже приведены примерные образцы тестовых заданий:

1. Отметьте правильный ответ

По какой формуле определяется электропроводность собственного полупроводника:

- ☐ $\sigma = e n \mu_n$ 1965
- ☐ $\sigma = e n \mu_p$ 1978
- ☒ $e n \mu_n + e n \mu_p$ 1998

2. Отметьте правильный ответ

Вгоду создан первый сканирующий туннельный микроскоп

- ☒ 1982
- ☐ 1996
- ☐ 2005

3. Вставьте

В году был разработан сканирующий атомно-силовой микроскоп

- ☒ 1986

4. Отметьте правильный ответ

Частотная область реализации квазистатического вольтфарадного метода

- ☒ период измерительного сигнала больше времени жизни неосновных носителей заряда
- ☐ период измерительного сигнала меньше времени жизни неосновных носителей заряда
- ☐ период измерительного сигнала равен времени жизни неосновных носителей заряда

5. Отметьте правильный ответ

Что означает приставка «нано-»?

- ☐ 10^{-6}
- ☐ 10^{-10}
- ☐ 10^{-9}
- ☒ 10^{-12}

6. Отметьте правильный ответ

7. Тонкая пленка это:

- ☐ Одномерная наноструктура
- ☐ Трехмерная наноструктура
- ☒ Двухмерная наноструктура
- ☐ Нульмерная наноструктура

8. Отметьте правильный ответ

В тонкой пленке квантование электронного спектра наблюдается в

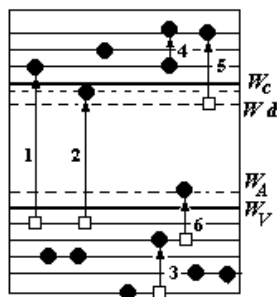
- ☒ одном направлении
- ☐ в трех направлениях
- ☐ в двух направлениях
- ☐ не наблюдается

9. Отметьте правильный ответ

При увеличении ширины квантовой ямы в 2 раза, значение энергии квантового уровня:

- ☒ Увеличится в 2 раза
- ☐ Уменьшится в 2 раза
- ☐ Увеличится в 4 раза
- ☐ Уменьшится в 4 раза

10. Вставьте



На схеме представлены переходы электронов, отвечающие различным механизмам поглощения квантов света полупроводниками.

Переход ... соответствует примесному поглощению в акцепторных полупроводниках.

+: 6

11. Отметьте правильный ответ

Оптическое возбуждение носителей заряда с последующим переходом электронов и дырок с одного энергетического уровня на другой внутри зоны проводимости и валентной зоны называется:

- ☒ поглощением носителями заряда
- ☐ экситонным поглощением
- ☐ собственным поглощением

Методические рекомендации

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Знать, сколько тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

Критерии оценивания

Таблица 8. Критерии оценивания результатов тестирования

Оценка			
неудовлетворительно 0 баллов	удовлетворительно 3 балла	хорошо 4 балла	отлично 5 баллов
Менее 50 % правильно выполненных заданий.	50-70% правильно выполненных заданий.	71-85% правильно выполненных заданий.	86-100% правильно выполненных заданий.

5.3. Задания для практических занятий

(Контролируемые компетенции ПК-2)

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Тематика практических занятий формируется на основе учебного материала излагаемого на лекциях и предлагаемого для самостоятельной проработки.

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях, включая выдачу индивидуальных тем для мини – доклада с презентацией по ключевым вопросам практического занятия. Доклад готовится одним студентом либо группой студентов. Независимо от того готовит студент доклад по теме или нет требуется самостоятельная проработка обозначенной темы, чтобы обсуждение материала было предметным и взаимно полезным.

Ниже приведен примерный план проведения практического занятия №2 по теме «Влияние размерных факторов на свойства и параметры наноматериалов и наноструктур».

План практического занятия:

1. Преподаватель в краткой форме характеризует круг рассматриваемых вопросов, устанавливает акценты на цели и задачи предстоящего занятия.
2. Выступление студента, доклад на тему «Определение холловской подвижности и концентрации основных носителей заряда в полупроводниках»
3. Обсуждение и дополнения доклада.
4. Опрос студентов по ключевым вопросам практического занятия:

Примерный перечень вопросов и заданий

1. В чем суть холловской подвижности носителей заряда?
2. Какие факторы на подвижность зарядов?
3. Приведите методы измерения подвижности носителей заряда в нанобъектах.
4. Какова роль поверхности в формировании свойств низкоразмерных систем?
5. Какие механизмы рассеяния носителей заряда влияют на подвижность в области низких температур?
6. Как сказываются размерные на подвижность носителей заряда?
7. Критерии размерного фактора, при котором наблюдается квантование спектра электронных состояний.
5. Заключение преподавателя: резюмирует выступление студентов, указывает на допущенные ошибки и проясняет вопросы, связанные с ними, публично оценивает работу студентов с выставлением баллов, предлагаются темы мини – докладов на следующее занятие.

Методические рекомендации

Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

- организационный;
- закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы;

составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов.

В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю.

Подготовка мини- доклада с презентацией материала предполагает более глубокую подготовку по теме доклада. Желательно, чтобы студент при подготовке докладов по темам касающимся методов получения и модификации наноматериалов и наноструктур и способам контроля их параметров обращался к патентным источникам. Мини- доклад готовится на выступление рассчитанное примерно на 7-10 минут.

Критерии оценивания

Студент, успешно работающий на практических занятиях получает в конце семестра 21 балл(см. табл.6). Шкала оценивания работ на занятиях устанавливается в начале семестра и доводится до сведения обучающихся студентов.

Таблица 9. Примерная шкала оценивания работы студента на практических занятиях

№ п/п	Вид работы	Максимально возможное количество баллов за контрольную точку
1.	Доклад с презентацией материала по теме занятия(не менее 3 докладов в семестре)	9
2	Устные либо письменные опросы на практическом занятии	9
3	Активная работа (участие в обсуждениях, дополнения ответов, заинтересованность и т.д.)	3

5.4. Промежуточная аттестация

5.4.1. Зачет

(Не предусмотрен программой).

5.4.2. Экзамен

Примерный перечень основных вопросов, выносимых на экзамен приведен ниже:

1. Особенности измерения физических величин в наномасштабах
2. Метрологические аспекты наноиндустрии.

3. Основные стандарты нормативные акты по планированию и организации работ по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур.
4. Методы статистической обработки результатов измерений и формы их представления.
5. Оптическая микроскопия: виды микроскопии, особенности применения в исследованиях наноматериалов и наноструктур.
6. Сканирующая атомно-силовая: основы метода, аппаратная реализация, режимы сканирования, объекты и параметры измерения.
7. Сканирующая туннельная микроскопия: основы метода, аппаратная реализация, режимы сканирования, объекты исследования, параметры измерения и разрешение.
8. Сканирующая электронно-растровая микроскопия: основы метода, аппаратная реализация, режимы сканирования, объекты исследования, параметры измерения и разрешение.
9. Просвечивающая электронная микроскопия: основы метода, аппаратная реализация, режимы сканирования, объекты исследования, параметры измерения и разрешение.
10. Рентгенодифракционные методы анализа наноматериалов: общая характеристика методов, особенности исследования наноматериалов и наноструктур.
11. Методы определения удельной поверхности, пористости и размера частиц нанопорошков.
12. Зондовые методы измерения удельного сопротивления: Однозондовый, двухзондовый, трехзондовый, четырехзондовый и пятизондовый методы измерения удельного сопротивления.
13. Методика измерения удельного сопротивления методом встречных зондов.
14. Контактные и бесконтактные методы измерения удельного сопротивления.
15. Метод Ван-дер-Пау. Метод Ван-дер-Пау для измерения концентрации и подвижности.
16. Емкостной и индуктивный методы измерения удельного сопротивления.
17. СВЧ-методы измерения удельного сопротивления.
18. Методы определения параметров полупроводниковых материалов с использованием эффекта Холла в постоянных и переменных электрических и магнитных полях.
20. Измерение подвижности неравновесных носителей заряда методом стационарной фотопроводимости.
21. Измерение диффузионной длины неравновесных носителей заряда методом стационарной фотопроводимости.
22. Измерение времени жизни неравновесных носителей заряда методом релаксации фотопроводимости.
23. Оптические методы измерения характеристик зонной структур: ширина запрещенной зоны, энергия активация примесей, энергия образования экситонов.
24. Термостимулированные методы. Физические основы релаксационной спектроскопии глубоких уровней (РСГУ).
25. Основные виды РСГУ: емкостная и токовая РСГУ.
26. Магнитно-силовая микроскопия: основы метода, аппаратная реализация, режимы сканирования, объекты исследования, параметры измерения и разрешение.

Методические рекомендации при подготовке к экзамену

Подготовка студентов к экзамену включает проработку лекций, в течение семестра и непосредственную подготовку в дни, предшествующие экзамену, включая, подготовку к коллоквиумам, тестированию, выполнению лабораторных работ и их защиту.

Для подготовки к ответам на экзаменационные вопросы (они выдаются в конце семестра) студент должен использовать не только курс лекций, но и основную и дополнительную литературу для выработки умения давать развернутые ответы на поставленные вопросы.

В ходе подготовки к экзамену студенту необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания изучаемых вопросов. Механическое запоминание числовых значений характеристик материалов не рекомендуется, но студент

должен отчетливо представлять себе порядок этих величин. Непосредственная подготовка студента к экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

Критерии оценивания

По итогам экзамена студенту, из максимального количества баллов, которое составляет 30, выставляется:

1) от 27 до 30 баллов, если владеет программным материалом по дисциплине в полном объеме; достаточно глубоко осмысливает дисциплину, исчерпывающе отвечает на все вопросы; умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы;

2) от 24 до 26 баллов, если владеет программным материалом почти в полном объеме (имеются пробелы только в некоторых особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенные, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах;

3) от 15 до 23 баллов, если владеет основным объемом программного материала по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускает ошибки по существу вопросов.

В случаях, когда обучающийся не освоил обязательный минимум программного материала по дисциплине, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах, выставляется 0 баллов. Студент, набравший 36 баллов в ходе текущего и рубежного контроля, к экзамену не допускается. Ниже приведены критерии и показатели оценивания промежуточной аттестации.

Таблица 11. Критерии и показатели оценивания промежуточной аттестации

Шкала по традиционной пятибалльной системе			
Неудовлетворительно	Базовый уровень удовлетворительно / диф. зачет	Продвинутый уровень хорошо/ диф. зачет	Высокий уровень отлично/ диф. зачет
Шкала по балльно-рейтинговой системе			
46 – 60	61 – 80	81 – 90	91 – 100

5.5. Контроль курсовых работ

(контролируемые компетенции ПК-2).

Тематика курсовых работ, требования к ним и указания по их выполнению доводятся до сведения студентов в начале соответствующего семестра. Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных кафедрой тем, предварительно согласовав ее с научным руководителем. Студент совместно с научным руководителем курсовой работы уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, выбирает объект исследования, составляет план и определяет структуру работы.

Ниже приводится примерный перечень тематики курсовых работ:

1. Атомно-силовая микроскопия в диагностике наноматериалов и наноструктур.

2. Тунельно-зондовая микроскопия в диагностике наноматериалов и наноструктур.
3. Электронная микроскопия в диагностике наноматериалов и наноструктур..
4. Оптические методы диагностики наноматериалов.
5. Методы локального измерения электрофизических параметров наноматериалов и наноструктур.
6. Программное обеспечение средств диагностики материалов и нанотехнологий.
7. Государственная система аттестации и сертификации в России средств диагностики для исследования, контроля и аттестации материалов и нанотехнологий.
8. Современные методы исследования применяемые для характеристики нанокompозитных материалов.
9. Современные методы исследования нанокompозитных магнитных материалов.
10. Современные методы исследования нанопористых материалов.

Требования к структуре и содержанию курсовой работы

Курсовая работа должна представлять собой завершённое исследование, в котором анализируются исследовательские проблемы в рассматриваемой области, и раскрывается содержание и технологии разрешения этих проблем не только в теоретическом, но и в практическом плане на местном, региональном или федеральном уровнях. Работа должна носить творческий характер, отвечать требованиям логического и чёткого изложения материала, доказательности и достоверности фактов, отражать умения студента пользоваться рациональными приёмами поиска, отбора, обработки и систематизации информации и содержать теоретические выводы и практические рекомендации.

Структурно курсовая работа состоит из следующих разделов: титульный лист, введение, содержательная часть, заключение, литература, приложения(при необходимости). Объем курсовой работы должен быть не менее 25 страниц. Оформление работы проводится на листах формата А4, шрифт Times New Roman (кегель 14), интервал 1, поля (справа 1,2см, слева 3,0см, сверху и снизу 2,0см). Ссылки на цитируемую литературу, рисунки и таблицы сквозные. Глубина литературного поиска по тематике курсовой работы должна включать работы, опубликованные не позднее 10 лет на момент выполнения работы.

Выполнение курсовой работы складывается из нескольких этапов: анализ литературных и иных источников информации, составление плана работы, накопление и обработка фактического материала, написание и оформление работы, защита курсовой работы (проекта).

Критерии оценивания курсового проекта

Завершенная курсовая работа за неделю до защиты представляется студентом руководителю, который решает вопрос о допуске студента к защите курсовой работы.

Результаты защиты курсовой работы оцениваются дифференцированной отметкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). Ниже приведены критерии оценки:

Таблица 12. Критерии и показатели оценивания курсовой работы

Оценка			
неудовлетворительно менее 61 балла	удовлетворительно 61-80 баллов	хорошо 81-90 баллов	отлично 91-100 баллов
Работа выполнена не в соответствии с утвержденным планом, не раскрыто содержание каждого вопроса. Студентом не сделаны выводы по теме работы. Грубые недостатки в	Работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, но не полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Студентом не сделаны соб-	Работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Незначительные	Работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью раскрыто содержание каждого вопроса, студентом сформулированы собственные аргументированные выводы по

оформлении работы. При защите работы студент не владеет материалом, не отвечает на вопросы.	ственные выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы. При защите работы студент слабо владеет материалом, отвечает не на все вопросы.	замечания к оформлению работы. При защите работы студент владеет материалом, но отвечает не на все вопросы.	теме работы. Оформление работы соответствует предъявляемым требованиям. При защите работы студент свободно владеет материалом и отвечает на вопросы.
---	--	---	--

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения (компетенции)	Основные показатели оценки результатов обучения
Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и нанoeлектроники различного функционального назначения(ПК-2)	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - основные свойства и процессы позволяющие проводить характеризацию и построение простейших физических и математических моделей наноматериалов и наноструктур необходимых для решения научных и производственных задач, связанных с измерением параметров объектов нанотехнологии в электронике (31) - основные методы измерений параметров наноматериалов и наноструктур (32); - знает физические принципы основных экспериментальных методов исследования материалов и структур, используемых в физике и технологии нанoeлектроники, условия и границы применения этих методов (33).
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - выбрать и создать модель схемы измерения параметров свойств объектов нанотехнологии в электронике (У1). - анализировать и систематизировать экспериментальные данные по исследованию объектов нанотехнологии в электронике(У2). - выбирать оптимальные методы исследования и диагностики необходимых свойств нано- и микросистем(У3).
	Владеть: <ul style="list-style-type: none"> - первичными навыками использования программных средств для создания математических и физических моделей связанных с оценкой параметров наноматериалов (В1). - методами эффективного поиска информации по современным методам исследований о перспективных направлениях развития устройств для изучения и анализа наноструктур (В2)

	<ul style="list-style-type: none"> - навыками подготовки отчетов по научно-исследовательской работе и научных публикаций (В3). - навыками интерпретации полученных экспериментальных данных (В4).
--	---

Таблица 14. Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

№	Состав	Формирование элементов компетенции		
		(З1), (З2), (З3)	(У1),(У2),(У3)	(В1), (В2), (В3), (В4)
1.	Содержание этапов			
2.	Виды занятий	1. Лекции 2. Консультации 3. Самостоятельная работа 4. Курсовая работа	1. Лабораторные работы 2. Самостоятельная работа 3. Курсовая работа	1. Лабораторные работы 2. Самостоятельная работа 3. курсовая работа
3.	Средства оценивания	1. <i>Посещение занятий</i> (см., разд.5, Табл. 6). 2. <i>Коллоквиум</i> (см., разд.5, Табл.7) 3. <i>Тестирование</i> (см., разд.5, Табл.8) 4. <i>Зачет</i> (см., разд.5, Табл.10) 5. <i>Курсовая работа</i> (см., разд.5, Табл.11)	1. <i>Допуск и выполнение лабораторной работы</i> (см., разд.5, Табл.9) 2. <i>Обработка результатов и подготовка отчета о выполненной работе.</i> (см., разд.5, Табл.9) 3. <i>Тестирование</i> (см., разд.5, Табл.8) 4. <i>Коллоквиум</i> (см., разд.5, Табл.7) 5. <i>Зачет</i> (см., разд.5, Табл.10) 6. <i>Курсовая работа</i> (см., разд.5, Табл.12)	1. <i>Защита результатов лабораторной работы</i> (см., разд.5, Табл.9) 2. <i>Тестирование</i> (см., разд.5, Табл.8) 3. <i>Коллоквиум</i> (см., разд.5, Табл.7) 4. <i>Зачет</i> (см., разд.5, Табл.10) 5. <i>Курсовая работа</i> (см., разд.5, Табл.12)

Степень сформированности элементов компетенций в рамках изучения данной дисциплины включает 3 уровня (см. таблица 13)

Таблица 13. Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по этапам

Показатели и критерии	Знать	Уметь	Владеть
«Зачтено» (высокий уровень)	Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости	Обладает диапазоном умений, требуемых для решения творческих задач	Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы
«Зачтено» (базовый уровень)	Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в	Обладает диапазоном практических умений, требуемых	Адаптирует свое поведение к обстоятельствам в решении

	пределах изучаемой области	для решения определенных проблем в области исследования	проблем
«Зачтено» (пороговый уровень)	Обладает базовыми общими знаниями	Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач	Работает при прямом наблюдении

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Блесман, А. И. Теоретические основы методов исследования наноматериалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Блесман, В. В. Даньшина, Д. А. Полонянкин. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 78 с. — 978-5-8149-2506-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78478.html>.
2. Афонский, А. А. Электронные измерения в нанотехнологиях и в микроэлектронике [Электронный ресурс] / А. А. Афонский, В. П. Дьяконов ; под ред. В. П. Дьяконов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 688 с. — 978-5-4488-0055-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/63585.html>.
3. Павлов Л.П., Методы измерения параметров полупроводниковых материалов. М.: Высшая школа. 1987. 240 с.
4. Метрологическое обеспечение нанотехнологий и продукции nanoиндустрии [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Д. Анашина, С. Е. Андрюшечкин, С. И. Аневский [и др.]; под ред. В. Н. Крутиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2011. — 591 с. — 978-5-98704-613-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33401.html>

Дополнительная литература

1. Афонский, А. А. Измерительные приборы и массовые электронные измерения [Электронный ресурс] / А. А. Афонский, В. П. Дьяконов. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. — 541 с. — 5-98003-290-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8696.html>
2. Нанотехнологии. Физика. Процессы. Диагностика. Приборы. // Под редакцией В.В. Лучинина, Ю.М. Таирова. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2006 – 551с.
3. Крутиков, В. Н. Нормативно-правовое обеспечение единства измерений. Том 1 [Электронный ресурс] / В. Н. Крутиков, С. А. Кононогов, Ю. М. Золотаревский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 736 с. — 978-5-98704-793-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33077.html>
4. Смирнов, С. В. Методы и оборудование контроля параметров технологических процессов производства наногетероструктур и наногетероструктурных монолитных интегральных схем [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. — 115 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13944.html>
5. Фомин Д.В. Экспериментальные методы физики твердого тела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фомин Д.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 185 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/57258>.— ЭБС «IPRbooks»

6. Миронов В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Уч. пособие для студентов старших курсов высших учебных заведений. Российская академия наук, Институт физики микроструктур. Н. Новгород, 2004.-114 с.
7. Компьютерная микроскопия [Текст] / В. Г. Пантелеев, О. В. Егорова, Е. И. Клыкова. - Москва : Техносфера, 2005. - 303 с. : ил. - (Мир материалов и технологий). - Библиогр.: с. 302-303. - ISBN 5-94836-025-3 (в пер.).
9. ГО С Т Р 56748 .1—2015/ISO/TS 12901-1:2012: Наноматериалы.
11. www.consultant.ru/ - Справочно-информационная система «Консультант плюс».
12. <http://www.garant.ru/> - Справочно-информационная система «Гарант».
13. ЭБС «Консультант студента» <http://www.studmedlib.ru>

Интернет - ресурсы

1. <http://lib.kbsu.ru/> - Библиотека КБГУ.
2. <http://www.garant.ru/> - Справочная правовая система «Гарант».
3. <http://www.consultant.ru/> -Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
4. <http://www.studmedlib.ru> - ЭБС «Консультант студента»
5. www.rusnano.com -ОАО «РОСНАНО» – флагман российских нанотехнологий
6. www.nanometr.ru -Интернет-журнал «Нанометр» – маяк российской нанонауки
7. www.ntmdt.ru -Компания НТ-МДТ – форпост российской наноинженерии
8. www.portalnano.ru -Федеральный интернет-портал «Нанотехнологии и наноматериалы»
9. www.nanonewsnet.ru -Информационно-аналитический портал в области наноиндустрии
10. www.rusnanonet.ru -Информационно-аналитический портал российской национальной нанотехнологической сети
11. www.nanojournal.ru -Российский электронный наножурнал
12. www.kiae.ru Российский научный центр «Курчатовский институт»

8. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий

1. Студенты имеют доступ к единому образовательному portalу, где могут в открытом доступе пользоваться ресурсами учебно-методической литературы, являющимися разработками ведущих ВУЗОВ России.
2. Для рейтингового контроля используется система компьютерного тестирования на базе программного обеспечения Moodle.
3. При выполнении лабораторного практикума студенты в обязательном порядке проводят обработку экспериментальных данных с применением программных пакетов Microsoft Excell, MathCad (Academic MathCAD License).
4. В рамках обеспечения применения компьютерных технологий в образовательном процессе имеются специализированные компьютерных класса с современным программным обеспечением и имеющим выход в Интернет.
5. Продукты MICROSOFT (Desktop Education ALNG LicSaPk OLVS Academic Edition Enterprise) подписка (Open Value Subscription) № V 2123829.
6. Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition № лицензии 17E0-180427-050836-287-197.
7. Архиватор 7z (бесплатное ПО).
8. Программа для работы с pdf публикациями Adobe Reader (бес-платное ПО).
- 10 Пакет математического анализа SMath Studio (бесплатное ПО).
11. Система построение графиков SciDAVis (бесплатное ПО).
12. Среда разработки виртуальных приборов MyOpenLab (бесплатное ПО).

9. Материально-техническое обеспечение работы

Материально-техническую базу для проведения занятий по дисциплине составляют:

- специализированная аудитория, используемая при проведении занятий лекционного типа №238, расположенная по адресу: 360004, Кабардино-Балкарская

- республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 175, учебный корпус университета №4 (ФМФ), оснащенная мультимедийным проектором и комплектом аппаратуры, позволяющей демонстрировать текстовые и графические материалы;
- рабочее место преподавателя;
 - рабочие места студентов;
 - меловая доска.

Мультимедийная презентация, сопровождающая лекцию, позволяет преподавателю акцентировать внимание студенческой аудитории на ключевых вопросах лекции.

Дисциплина обеспечена:

- тестовым материалами в электронной обучающей системе «Moodle» (Открытый университет);
- книжным фондом библиотеки;
- электронными версиями учебников.

Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в лаборатории «Материалы и компоненты твердотельной электроники», оснащенной следующим оборудованием и измерительной техникой:

1. Лабораторный стенд по изучению термоэлектрических явлений.
2. Установка магнетронного распыления материалов
3. Установка вакуум-термического напыления тонких пленок
3. Установка для измерения удельного сопротивления тонких пленок.
4. Лабораторный стенд изучения магнитных свойств.
5. Лабораторный стенд по измерению удельного сопротивления методом 4-х зондов.
6. Лабораторный стенд по измерению вольтамперных характеристик полупроводниковых элементов.
7. Лабораторный стенд по электрохимическому анодированию.
8. Лабораторный стенд измерения параметров полупроводниковых материалов по релаксации фотопроводимости.
9. Измеритель характеристик полупроводниковых приборов Л2-56;
10. Оптический микроскоп высокого разрешения LATIMET-20.
11. Установка контактной сварки.
12. Лабораторный стенд измерения ЭДС Холла.
13. Цифровые вольтметры, амперметры, мосты постоянного и переменного тока, генераторы, осциллографы, источники питания, мультиметры и др.
14. ПК-4 шт.
15. Ноутбук- 1 шт.

Студенты имеют доступ через Интернет доступ к электронной обучающей системе «Moodle» (Открытый университет), которая позволяет размещать электронные учебные курсы в свободном доступе для студентов университета.

При проведении занятий лекционного типа, семинарских занятий и др. используются:

лицензионное программное обеспечение и свободно распространяемые программы:

- ✓ Microsoft Office лицензия: Договор №135 от 22.05.2018, договор № л-21100 от 20.09.2017, сертификат от 29.11.2017, договор № 28/2017-31705322460 от 29.08.2017, договор № 18/2016-31603884322 от 12.08.2016, договор № 4/14-08 от 14.08.2015, договор № 1/01-12 от 01.12.2014, договор №0331100002314000061-0003152-01 от 25.11.2014, договор №0331100002314000077-0003152-01 от 29.12.2014, договор №0331100002314000038-0003152-01 от 10.09.2014, сертификат от 20.04.2009, сертификат от 18.06.2008, сертификат от 12.10.2007, сертификат от 14.03.2007;
- ✓ архиватор 7z, Adobe Acrobat Reader лицензия: предоставляется бесплатно на условиях по адресу <https://www.adobe.com/ru/legal/terms.html>;

- ✓ Mozilla Firefox лицензия: GPL/LGPL/MPL, Google Chrome лицензия: предоставляется бесплатно на условиях лицензионных соглашений на программное обеспечение с открытым исходным кодом по адресу <https://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html>.
- ✓ . Программа для работы с pdf публикациями Adobe Reader (бес-платное ПО)
- ✓ Пакет математического анализа SMath Studio (бесплатное ПО)
- ✓ Система построение графиков SciDAVis (бесплатное ПО)
- ✓ Среда разработки виртуальных приборов MyOpenLab (бесплатное ПО)

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для получения образования. Специализированное помещение для инвалидов расположено по адресу: 360004, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, главный учебный корпус университета, аудитория №145.

В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается:

- ✓ альтернативной версией официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;
- ✓ присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- ✓ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).

**Лист изменений (дополнений)
в рабочей программе дисциплины**

**Б1.В.02.ДВ.02.02 «ДИАГНОСТИКА ПАРАМЕТРОВ НАНОМАТЕРИАЛОВ
И НАНОСТРУКТУР»**

11.03.04 – Электроника и нанoeлектроника на 2021-2022 учебный год

№ п/п	Элемент (пункт)РДП	Перечень вносимых изменений (дополнений)	Примечание

*Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры_
электроники и цифровых информационных технологий,*
протокол № _____ от « ____ » _____ 2021 г.

Заведующий кафедрой _____ / **Р.Ш. Тешев** / _____
подпись расшифровка подписи дата